

日本顕微鏡学会 超分解能電子顕微鏡分科会

第5回研究会「高分解能STEM法の定量性とさらなる可能性」

日時 2010年3月5日(金) 13:00-17:00

場所 東京駅 東京八重洲ホール 301会議室

(定員60名 (会場スペースの都合上、定員にて、受付を締め切らせて頂きます))

会費 1,000円

趣旨

電子顕微鏡の高分解能化を目指し、電圧変動が小さく、かつ、電流が安定した電子線プローブの形成、収差のないレンズ系、振動やドリフトの少ない鏡体、そして、高感度の検出器の開発が精力的に進められてきた。このことは、電子顕微鏡の分解能を高めるに留まらず、顕微鏡像の定量解析や新しい顕微法への取り組みを触発している。今後、顕微鏡像の定量性に関する議論が活発になるだろう。本研究会は、定量解析や新しい顕微法に取り組まれている研究者の方々に、これまでの取り組みと今後の進展に関するお話を伺い、電子顕微鏡法のさらなる可能性について議論する。

13:05-13:10

「趣旨説明」

東京工業大学 谷城康真

13:10-14:00

「ADF像強度の散乱角依存性と定量解析の試み」

東京大学 阿部英司

14:00-14:30

「各種実験条件が高分解能STEM像に与える影響」

富士通研究所 山崎貴司、小高康稔

14:30-15:00

休憩

15:00-15:30

「収差補正STEMを用いた環状明視野法による軽元素サイトの直接観察」

日本電子(株) 奥西栄治、石川勇、沢田英敬、堀まどか、細川史夫、近藤行人

15:30-16:00

“Annular bright field scanning transmission electron microscopy”

Univ. of Tokyo S.D. Findlay, N. Shibata, H. Sawada, E. Okunishi, Y. Kondo, S. Azuma, T. Yamamoto, Y. Ikuhara

16:00-16:30

「シリコン結晶中のヒ素ドーパント原子検出」

東京工業大学 大島義文、橋本豊、澤田英敬、近藤行人、谷城康真、高柳邦夫

16:30-17:00

「総合討論」

(座長：前半 谷城康真、後半 阿部英司)

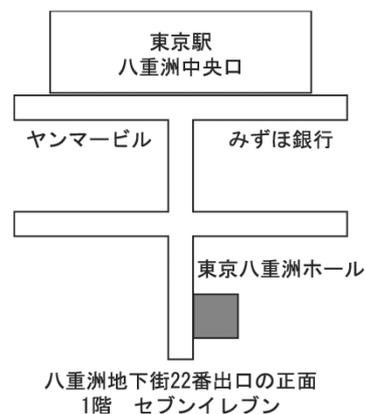
参加申し込み：下記世話人までメールでお願いします

第5回研究会世話人(問合せ先)：大島義文(東工大 院総理工)

TEL: 045-924-5619、E-mail: oshima.y.aa[a]m.titech.ac.jp

([a]は、@に直して送信してください)

分科会責任者 谷城康真(東工大 院理工)



アクセスマップ